

管理計画（ショットキー・バリア・ダイオード） CONTROL PLAN（Schottky Barrier Diode）

トレックス・セミコンダクター株式会社
TOREX SEMICONDUCTOR LTD.

代表例
[SMA-XG]

工程記号 Flow	No.	工程名 Process	主な管理項目 Major item checked	頻度 Frequency	備考 Note
◇	1	ウエハ受入 Wafer incoming	ロット番号, 員数照合 Lot No., Q'ty check	抜き取り Sampling	ウエハ工程(外注) Wafer process
○	2	酸化 Oxide	時間, 温度 Temperature, Time	チューブ交換時 Tube change	
◇	3	酸化膜チェック Oxide check	外観, 酸化膜厚 Appearance, OX thickness	抜き取り Sampling	
◇	4	チェック Check	外観, 測定 Appearance, Measure	抜き取り Sampling	
○	5	フォト工程 Photo lithography	品番照合 Against photo mask	作業開始時 At Starting	
◇	6	チェック Check	外観, 欠陥密度 Appearance, Defect density	抜き取り Sampling	
○	7	拡散 Drive	温度, 時間 Temperature, Time	作業開始時 At Starting	
◇	8	チェック Check	シート抵抗, 酸化 Sheet resistance, Oxidation	抜き取り Sampling	
○	9	金属膜形成 Metal deposition	真空度 Vacuumness	作業開始時 At Starting	
◇	10	メタルチェック Metal check	外観, 厚み, 表面状態 Appearance, Thickness, Surface	抜き取り Sampling	
◇	11	ウエハテスト Wafer test	電気的特性 Electrical characteristics	抜き取り Sampling	
○	12	ダイシング Dicing	位置ずれ, ブレードの磨耗 Position, Blade Condition		組立工程(外注) Assembly process
○	13	ダイはんだ付け Die Soldering	温度, 外観 Temperature, Appearance	抜き取り Sampling	
○	14	モールドイング Molding	外観 Appearance	抜き取り Sampling	
○	15	リードカット/フォーミング Lead cut/Forming	外観, 寸法測定 Appearance, Measuring dimensions	抜き取り Sampling	
○	16	はんだメッキ Solder plating	メッキ厚, 液組成 Plating thickness, composition	定期 Regularly check	
◇	17	電気的特性検査 / マーキング テーピング Electrical test / Marking Taping	電気的特性 / マーク テーピング強度 Electrical characteristics / Mark Taping strength	100% 1回/日 100% Per day	
◇	18	出荷検査 Out going inspection	ラベル, 外観検査 Label, Appearance	抜き取り Sampling	
○	19	梱包出荷 Packing /Shipping	伝票照合 Verification of product against slip	1回/ロット Per lot	